



(11) **EP 1 728 770 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Bibliographie INID code(s) 73, 74

(51) Int Cl.:
C03C 23/00 ^(2006.01) **C03C 17/00** ^(2006.01)
B41M 5/26 ^(2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
15.10.2008 Patentblatt 2008/42

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
23.07.2008 Patentblatt 2008/30

(21) Anmeldenummer: **06008720.2**

(22) Anmeldetag: **27.04.2006**

(54) **Verfahren zur Markierung von Objektoberflächen**

Process for marking the surface of articles

Procédé pour le marquage des surfaces d'objets

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SK TR**

(30) Priorität: **03.06.2005 DE 102005026038**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
06.12.2006 Patentblatt 2006/49

(73) Patentinhaber: **boraident GmbH**
06118 Halle/Saale (DE)

(72) Erfinder:
• **Rainer, Thomas, Dr.**
38855 Wernigerode (DE)
• **Berg, Klaus-Jürgen, Dr.**
06130 Halle (DE)
• **Redmann, Dr. Frank**
06114 Halle (DE)

(74) Vertreter: **COHAUSZ DAWIDOWICZ
HANNIG & SOZIEN**
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Postfach 14 01 61
40071 Düsseldorf (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A2- 1 110 660 US-A1- 2003 071 020
US-B1- 6 177 151

- **TANAHASHI ET AL:** "Effects of heat treatment on Ag particle growth and optical properties in Ag/SiO₂ glass composite thin films" **JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH**, Bd. 10, Nr. 2, Februar 1995 (1995-02), Seiten 362-365, XP002417063
- **HAYASHI M ET AL:** "ELECTROLUMINESCENCE FROM CDSE MICROCRYSTALS-DOPED INDIUM TIN OXIDE THIN FILMS" **JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, SPRINGER / BUSINESS MEDIA, DORDRECHT, NL**, Bd. 33, Nr. 19, 1, Oktober 1998 (1998-10-01), Seiten 4829-4833, XP000791551 ISSN: 0022-2461
- **NIKOLAEVA M ET AL:** "Ion beam assisted formation of Ag nanoparticles in SiO₂ and their optical properties" **NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH, SECTION - B: BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL**, Bd. 193, Nr. 1-4, Juni 2002 (2002-06), Seiten 867-870, XP004367424 ISSN: 0168-583X
- **NASU H ET AL:** "Influence of matrix on third order optical nonlinearity for semiconductor nanocrystals embedded in glass thin films prepared by Rf-sputtering" **JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, NORTH-HOLLAND PHYSICS PUBLISHING. AMSTERDAM, NL**, Bd. 351, Nr. 10-11, 15. April 2005 (2005-04-15), Seiten 893-899, XP004844756 ISSN: 0022-3093

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 1 728 770 B8